

DSP-based power-quality monitoring device

Märtens, Olev; Trappärk, Harri; Liimets, Aivar; Nobel, Peter; Veskimeister, Andres; Järvalt, Aldur WISP2007 proceedings : 5th IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing : Alcala de Henares, Madrid (Spain), October 3-5, 2007 2007 / [5] p <https://ieeexplore.ieee.org/document/4447591>

Численное моделирование технологического процесса изготовления полупроводниковых приборов. Модель диффузии

Nobel, Peter XXVII студенческая научно-техническая конференция вузов Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Молдавской ССР, 19-21 апреля 1983 г. : тезисы докладов. Часть 3 1983 / с. 14 https://www.eester.ee/record=b1571572*est